

Conférences

MARDI 23 OCTOBRE

Salle 1

- 9h30** LTE-M, NB-IOT, 5G : différences, mise en œuvre et principaux cas d'usages (CAP'TRONIC)
• Stéphanie RICHÉ, *Responsable partenariats au département systèmes, CEA LETI*
• Grégoire de CHANGY, *IoT marketing manager, ORANGE*
• Thibault CANTEGREL, *Directeur Programme Développeur, SIERRA WIRELESS*

- 14h00** Table ronde « Nouvelles technologies de la vision industrielle et de son rôle dans l'industrie du futur » (REVUES ELECTRONIQUES / MESURES)
• Pascal COUTANCE, *Directeur des rédactions, revues Electroniques et Mesures*
• Arnaud DESTRUELS, *European Marketing Manager, SONY EUROPE*
• Philippe BERGER, *Director of Business Development IA, PROPHESEE*
• Abel GAGNE, *COGNEX (à confirmer)*
• Damien LEGRAND, *Vision Systems Project Leader, IFM (à confirmer)*

- 15h00** Du capteur au Cloud : une nouvelle ère pour l'industrie de demain, un véritable potentiel (HBM)
• Intervenant à venir, HBM (Conférence en anglais)

Salle 2

- 10h00** Journée "Contrôle, qualité et lutte anti contrefaçon" (ARMIR / CAP'TRONIC)

- 10h00** Panorama général de la lutte anti-contrefaçon
• David SAUSSINAN, *Responsable juridique et affaires publiques, UNIFAB*

- 10h45** Analyse de contrefaçon pharmaceutiques par technologie THz
• Bernard FISCHER, *ISL*

- 14h15** Analyse vidéo des marques de sécurité
• Romain LE BLOA, *FOSTER & FREEMAN*

- 15h00** THID : une technique nouvelle THz pour l'identification des produits
• Frédéric GARET, *Maître de conférences, IMEP-LAHC*

- 15h45** Vers la détection de contrefaçons par contrôle THz impulsionnel ultrarapide : imagerie couplée à la caractérisation de matériaux
• Marco CAVALLARI, *Chief Commercial Officer, TERATONICS*

Salle 3

- 9h00** Industry 4.0 : Deep Tech pour le Smart Manufacturing (OPTICS VALLEY)
Accès payant

- 9h00** Accueil café

- 9h30** Table ronde Quelle place pour la DeepTech dans l'Industrie du futur ?
Modérateur : Karl GEDDA, *Directeur Général, Opticsvalley*
• Frédéric AMBLARD, *Institut List CEA Saclay Nano-INNOV, Directeur Factory Lab*
• Moundir RACHIDI, *Director, THE BOSTON CONSULTING GROUP*
• Aymeric DE PONTBRIAND, *CEO, SCORTEX*
• Florence MASSENOT, *Chef de projet Industrie du Futur, BUSINESS FRANCE*

- Axe 1 avec démonstrations - Les matériaux et les procédés avancés de fabrication*
10h20 How Additive manufacturing is enabling personalized products
• André DROCHNER, *Key account Manager, 3YOURMIND*

- 10h35** Intérêt de la simulation numérique en fabrication additive métallique
• Yéli TRAORE, *Responsable process fabrication additive, STYX TECHNOLOGIES*

- 11h00** Des nanoparticules pour booster les matériaux du futur
• Yuyang MIAO, *Ingénieur commerciale business développement & innovation, NANOMAKERS*

- 11h15** Les récents usages du laser comme outil de production
• Julien DECLoux, *Président et CEO, SILLTEC*

- Axe 2 avec démonstrations - Le contrôle qualité temps-réel en ligne de production*
11h30 L'imagerie hyperspectrale : aller plus loin dans le contrôle non-destructif avancé pour l'industrie
• Julien ROMANN, *Responsable R&D, PHOTON LINES*

- 11h45** Contrôle de procédé temps réel in situ pour la fabrication additive
• Claude LEONETTI, *PDG, TP5H*

- 12h00** Technologie terahertz monocouche pour l'inspection et le Contrôle Non Destructif (CND) en ligne dans l'industrie du futur
• Marco CAVALLARI, *Chief Commercial Officer, TERATONICS*

- 12h15** Tomographie X par Accélérateur Laser Plasma
• François SYLLA, *Président, SOURCELAB*

- 12h30** Cocktail de fin avec networking

- 14h00** Optimisation des périodicités d'étalonnage (CFM)
• Bernard LARQUIER, *Directeur, BEA METROLOGIE*
Quizz : Etalonnage et vérification : quelle différence

- 15h00** La métrologie au service de l'industrie du futur (FARO)

MERCREDI 24 OCTOBRE

Salle 1

- 9h30** L'IA dans l'embarqué : les grands principes et contraintes (CAP'TRONIC)
• Sandrine VARENNE, *CEA*
• Sabri BAYOUDH, *CTO, ARCURE*
• Michel PAINDAVOINE, *CTO, GST « Global Sensing Technologies »*
• Stéphane CORDOVA, *VP, Embedded Business Unit, KALRAY*

- 14h00** L'IA au service de l'humain, est-ce bien le cas ? (Bernard MONNIER, MIM)
Exposés généraux d'introduction :
• Laurence DEVILLERS, *Professeure en informatique appliquée aux sciences sociales, Université Paris-Sorbonne 4*
• Judith NICOGLOSSIAN, *Antropologue, JANSSEN HORIZON comité scientifique, Neurosciences Grenoble Alpes*
• Stéphane RODER, *THE AI BUILDERS*

- Exemple marquant d'un domaine d'intérêt : la Santé
• Guy VALLANCIEN, *Professeur d'Urologie à l'Université Paris Descartes, membre de l'Académie nationale de médecine et de chirurgie*
• Christophe RICHARD, *Santé, ATOS*

- Les aspects juridiques
• Nathalie PUIGSERVER, *Avocat Associé - Droit du Numérique & de la Data, P3B AVOCATS*
• Julia PETRELLUZZI, *Ph.D student Droit et intelligence artificielle*

- Des startup, PME impliquées :
• Yoel TORDJMAN, *Formation à l'IA en entreprise, DATASCIENTEST*
• Mounir HADDAD, *Internet, DSI CONSULTING*
• Benoit RAPHAEL, *Eleveur de robots, FLINT MEDIA*
• Pierre HEBRARD, *Co-fondateur et CEO, PRICEMOOV*
• Julien de SANCTIS, *Spoon.ai*
• Jérôme BOURREAU, *Président, ANAMNESE*

Salle 2

- 9h30** La photonique pour la mobilité autonome (ENEKA CONSULTING)
• Dr Eneka IDIART BARSOUM, *Conseil en innovation, ENEKA CONSULTING*

- 10h30** La mutation automobile vers les véhicules autonomes a déjà commencé, participez à la transition ! (NATIONAL INSTRUMENTS)
• Emmanuel ROSET, *Senior Field Marketing Manager for Automotive, NATIONAL INSTRUMENTS*

- 11h30** Technologies optiques pour la détection de contrefaçons (ARMIR / CAP'TRONIC)
• Julien ROMANN, *Responsable R&D, PHOTON LINES*

- 12h00** L'évolution des technologies microélectroniques et des systèmes vers les objets connectés et l'IoT (GIP CNFM)
• Olivier BONNAUD, *Directeur Général, GIP CNFM*

- 14h00** Quelles connaissances avoir avant d'utiliser des caméras de vision industrielles pour des applications embarquées ? (ALLIED VISION TECHNOLOGIES)
• Benoit OSTIZ, *Sales manager France, ALLIED VISION TECHNOLOGIES*

- 15h00** Métrologie du Futur : comment dématérialiser la gestion de vos étalonnages ? (EUROTHERM AUTOMATION)
• Carlos MARTINS, *Ingénieur Technico-commercial, EUROTHERM AUTOMATION*

Salle 3

- 9h30** Pourquoi estimer ses incertitudes de mesure ? (CFM)
• François HENNEBELLE, *Enseignant Chercheur, Université de Bourgogne*
Quizz : incertitude de mesure : que dois-je savoir ?

- 10h30** Comment accompagner les sociétés d'optoélectronique grâce à la mécatronique (ELYZEE CONSORTIUM)
• Yann HEZARD, *Responsable du Développement Commercial, STAE*
• François ROSALA, *Président, ADVEOTEC*
• Jean-François SOMME, *Président Directeur Général, ACMEL INDUSTRIE*
• Benoit D'HUMIERE, *Gérant, TEMATYS*

- 11h30** IoT et objets connectés : comment les enjeux de cybersécurité vont impacter les futures conformités réglementaires incluant le marquage CE des équipements (LCIE BUREAU VERITAS)
• Philippe, SISSOKO, *Directeur, LCIE BUREAU VERITAS*

- 14h00** Le reverse engineering pour l'industrie automobile (CFM)
• François HENNEBELLE, *Enseignant Chercheur, Université de Bourgogne*
Quizz : comment faire son choix en mesure 3D

